

公益社団法人日本顕微鏡学会 第77回学術講演会

# 優秀ポスター賞

[一般部門]

HARECXS法を用いたBaTiO<sub>3</sub>におけるドーパント占有サイトの定量解析

Quantitative Determination of Dopant  
Occupation Sites in BaTiO<sub>3</sub>,  
Using HARECXS Method

大塚 真弘, 忽那 真也, 武藤 俊介  
名古屋大学未来材料・システム研究所, 京セラ株式会社

2021年6月14~16日

第77回学術講演会

実行委員長 藤田 大介

